

АНОМАЛИИ ПРОЦЕССА АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

В.Э.Птицын, Г.Н.Фурсей, Н.В.Егоров

Приведены результаты экспериментального исследования автоэлектронной эмиссии (АЭ) острийных микрокристаллов W, Nb, Mo в магнитном поле. Обнаружено, что в процессе протекания тока АЭ большой плотности в магнитном поле происходит изменение состояния вещества эмиттера, приводящее к расширению (или сжатию) автоэмиссионного изображения, возникновению колебаний и обрыву тока АЭ во времени. Предполагается, что в этих условиях может иметь место фазовый переход металл – изолят, стимулированный деформацией вершины острия.

В работе [1] на эмиттерах из W было установлено, что при определенных плотностях тока магнитное поле начинает оказывать существенное влияние на автоэлектронную эмиссию.

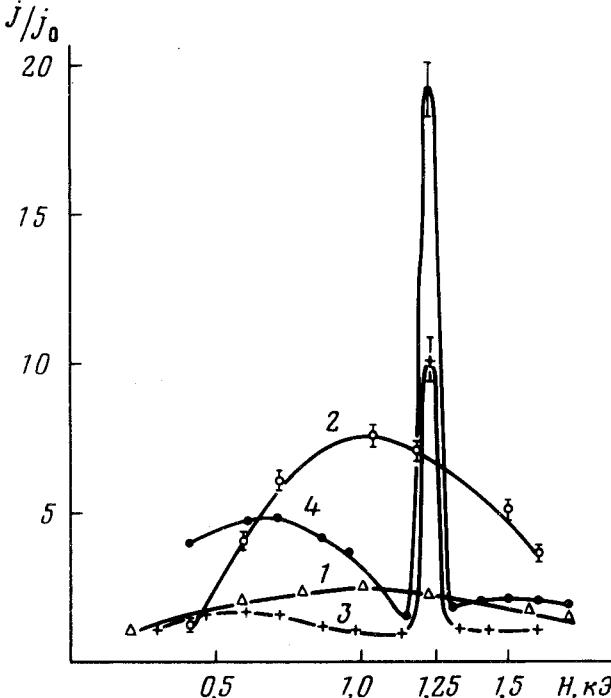


Рис. 1. Зависимость величины магнитного эффекта от напряженности внешнего магнитного поля: 1 — $W <001>$, $T = 77\text{ K}$; 2 — $\text{Nb} <011>$, $T = 300\text{ K}$; 3 — $W <001>$, $T = 300\text{ K}$; 4 — $W <001>$, $T = 77\text{ K}$

В настоящей работе обнаружены новые эффекты при автоэмиссионной эмиссии в магнитном поле на эмиттерах из W , Nb и Mo (рис. 1 — рис. 3)¹⁾.

1. Исследование зависимости относительного увеличения тока АЭ от напряженности магнитного поля H ($j/j_0 = f(H)$, где j , j_0 — плотность тока АЭ в магнитном поле и без магнитного поля, соответственно) показало, что она имеет резко немонотонный характер (рис. 1). Наблюдается два вида кривых $j/j_0 = f(H)$ — с плавным максимумом, полученные на образцах, изготовленных из поликристаллических проволок W , Nb , Mo , текстурированных в направлении $<011>$, и кривые с резкими максимумами для эмиттеров, изготовленных непосредственно из монокристалла $W <001>$ (рис. 1).

2. В области резких максимумов (рис. 1) обнаружено возбуждение колебаний тока АЭ во времени. Частота колебаний составляет $10^3 \div 10^5\text{ Гц}$ (рис. 2, а). Для конкретного образца условия возбуждения колебаний критичны к величине плотности тока АЭ и напряженности магнитного поля. Для различных эмиттеров величины j_0 , при которых происходит возникновение колебаний, могут несколько отличаться, составляя в среднем $j_0 \approx (1 \div 2) \cdot 10^5\text{ A/cm}^2$.

При дальнейшем увеличении начальной плотности тока АЭ до $j = (3 \div 5) \cdot 10^5\text{ A/cm}^2$ наблюдается срыв колебаний и прекращение (обрыв) тока АЭ до окончания действия импульса напряжения (рис. 2, б).

¹⁾ Эксперименты проводились в автоэмиссионном микроскопе-проекторе Мюллера в импульсном режиме. Давление остаточных газов $p \leq 5 \cdot 10^{-10}\text{ Torr}$. Длительность импульса напряжения варьировалась в пределах $10^{-4} \leq \tau \leq 3 \cdot 10^{-3}$ сек, магнитное поле в пределах $0 \leq H \leq 2,0\text{ kOe}$.

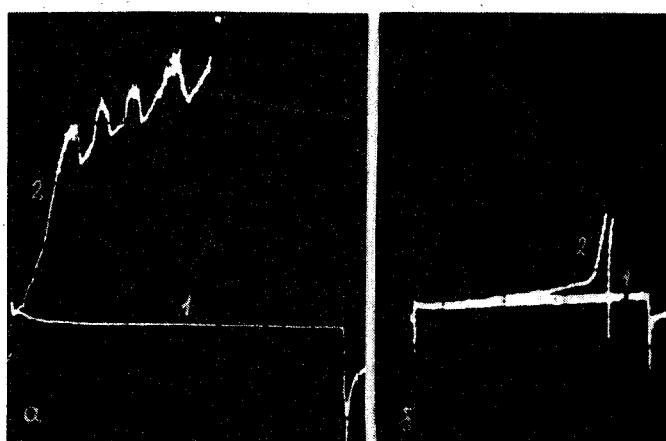


Рис.2. Изменение тока АЭ в магнитном поле во времени,
 $W <001>$: а - 1. - $H = 0$; 2 - $H = 1,25$ кЭ ($j_o = 2 \cdot 10^5$ А/см²);
 б - 1. - $H = 0$; 2 - $H = 1,25$ кЭ ($j_o = 3 \cdot 10^5$ А/см²)

Отметим, что указанные эффекты наблюдаются только при полях H , соответствующих областям резких максимумов (рис.1). Опыты на большом числе образцов однозначно свидетельствуют, что для всех других участков кривых $j / j_o = f(H)$ осцилляции и обрыв тока АЭ отсутствуют. Осциллографмы тока АЭ в магнитном поле при этом имеют вид кривых с насыщением [1].

3. Установлено, что под воздействием магнитного поля при протекании тока АЭ значительно изменяется размер эмиссионной картины. Измерения проводились в режиме "остаточного" эффекта, т.е. когда магнитное поле уже выключено, но образец еще не релаксировал к своему исходному состоянию. На большей части образцов наблюдалось расширение эмиссионной картины¹⁾.

Относительное увеличение расстояний между центрами плотноупакованных граней на эмиссионном изображении достигало 10%. Специальные опыты по исследованию возможных изменений размеров эмиссионной картины только в сильном электрическом поле вплоть до предельных плотностей тока $j \approx 10^7$ А/см² ($E \approx (6 \div 7) \cdot 10^7$ В/см) показали, что в отсутствии внешнего магнитного поля увеличение размеров эмиссионной картины существенно меньше и составляет $\approx (1,0 \div 1,5)\%$.

4. Во всех областях кривых $j / j_o = f(H)$, кроме участков резких максимумов (рис.1), имеет место отмеченное выше увеличение размеров эмиссионной картины, но, при этом, эмиссионное изображение существенно не изменяется и соответствует типичному изображению ато-

¹⁾На образцах, изготовленных из несовершенной вольфрамовой проволоки, имевших на вершине дислокационные нарушения в виде "двойника", наблюдался обратный эффект — сжатие эмиссионной картины. Соответственно и изменение АЭ тока в магнитном поле (j / j_o) было меньше единицы.

марно-чистой поверхности эмиттера (рис.3, а). В то же время в области резкого максимума кривых $j/j_0 = f(H)$ на эмиссионной картине (рис.3, б), помимо увеличения расстояний между центрами граней, происходят значительные качественные изменения, которые свидетельствуют о сильном разупорядочении вещества эмиттера. Такое изменение состояния поверхности является необратимым во времени. Для восстановления исходного состояния поверхности и "чувствительности" к магнитному полю необходим интенсивный нагрев эмиттера (до $T \approx 2500$ К).



Рис.3. Изменение АЭ изображения после эмиссии в магнитном поле, W<001>; а – исходное, $H = 0$; б – $H = 1,25$ кЭ

Отметим, что "чувствительность" эмиттера к магнитному полю также пропадает при адсорбции на поверхности эмиттера атомов остаточных газов.

Результаты последних опытов показывают, что на процесс АЭ в магнитном поле существенное влияние оказывает характер рассеяния электронов поверхностью эмиттера.

Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что в настоящее время предложить законченную модель явления затруднительно. Это вызвано тем, что в данном явлении могут оказаться взаимосвязанными целый ряд факторов: в частности, это большие плотности тока АЭ (до 10^7 А/см²), протекающего во внешнем магнитном поле; размерные факторы (радиус эмиттера $\approx 10^{-5}$ см); значительные отрицательные давления (до $\approx 2,5 \cdot 10^{-8}$ Н/см²) на эмиттер, температура которого ≈ 1000 К; большое отношение поверхности образца к его объему ($\approx 10^5$ см⁻¹) и, наконец, наличие границы раздела фаз – обрыв решетки кристалла.

Однако, можно утверждать, что важную роль в явлении играет деформация образца. Об этом свидетельствует изменение размера эмиссионной картины, зависимость процессов от совершенства микрокристалла и температуры эмиттера. Отметим, что j/j_0 существенно больше единицы при температурах образца ниже температуры Дебая – Θ и почти не зависит от H при $T > \Theta$, при этом $j/j_0 \gg 1$. Деформацией, в частности, можно объяснить рост АЭ тока во времени и расширение

эмиссионной картины, как следствие изменения формы и размеров эмиттирующей вершины микрокристалла.

Наконец, имеются основания предполагать, что в результате деформаций может произойти фазовый переход металл – изолятор [2], который приводит к обрыву АЭ тока (рис.2, б).

В заключение авторы приносят глубокую благодарность А.П.Смирнову, А.И.Шальникову И Л.П.Страхову за обсуждение результатов работы и ряд ценных замечаний.

Ленинградский электротехнический институт
связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Поступила в редакцию
25 февраля 1980 г.
После переработки
18 апреля 1980 г.

Литература

- [1] Г.Н.Фурсей, В.Э.Птицын, Н.В.Егоров. Письма в ЖТФ, 5, 1161, 1979.
[2] Н.Ф.Мотт. Переходы металл – изолятор. М., изд. Наука, 1979.